

Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu plnění

Pokyny pro vyplnění:

Účastník vyplní prázdná zelená pole následujícím způsobem:

Všechna prázdná zelená pole musí být vyplněna.

V buňce D10 uveďte název a typové označení nabízeného zařízení, ve sloupci D "Nabízené parametry" uveďte u každé položky nabízený parametr a u položek, kde není potřeba vyplňovat parametry, uveďte ANO, že výrobek danou nebo dané funkcionality/splňuje.

Nesplnění minimálních parametrů nebo neobsažení dané funkcionality je nesplněním zadávacích podmínek.

Položka	PROBE STATION PRO MIKROVLNNÁ MĚŘENÍ DO 110 GHz	Specifikace/minimální požadavky uživatele/požadavky na funkcionality	Nabízené parametry
	Parametry /funkcionality		Název a typ: Form Factor EPS150MMW-EDU
1	Možnost měřit wafery s průměrem	>= 150 mm	Ano, 155 mm
2	Antivibrační podložka na stlačený vzduch pod celé zařízení bez nutnosti pořizovat celý optický stůl	ANO	Ano
3	Dvě pracovní desky dostatečně velké pro uchycení dvou extenderů Z110E od Rohde & Schwarz	ANO	Ano
4	Měřič Z-police pracovních ploch pro nastavení overtravel sond	ANO	Ano
5	Držák waferu umožňuje plynulé pohyby v osách X a Y	ANO	Ano, rozlišení 5 µm
6	Držák waferu umožňuje pohyb v ose Z	ANO	Ano
7	Opakovatelnost přitisknutí sond na wafer v ose Z	<= 2 µm	< 1 µm
8	Přitisknutí sond na wafer probíhá opakovatelně pomocí zvedání pracovních ploch	ANO	Ano
9	Držák waferu umožňuje přichycení waferu pomocí vakua	ANO	Ano
10	Planarita plochy držáku waferu	<= ±4 µm	≤ ± 3 µm
11	Nastavení theta držáku waferu v rozsahu	>= ± 7°	± 8° mikroposuvem, 360° hrubé
12	Mikroskop se stereo okulárovou hlavou	ANO	Ano
13	Možnost připojit k mikroskopu fotoaparát nebo kameru přes C-mount	ANO	Ano
14	LED osvětlení plochy pod mikroskopem	ANO	Ano
15	Rozsah zoomu mikroskopu	>= 3x	3.2x
16	Dosažitelné optické zvětšení mikroskopu	>= 100x	320x s dodávaným objektivem
17	Optické rozlišení mikroskopu	<= 2 µm	1 µm
18	Rozsah ostření mikroskopu	>= ±20 mm	±25 mm.
19	Posun mikroskopu nad waferem v osách X a Y	>= 40 mm	50 mm x 50 mm
20	Dva precizní mechanické pozicionéry pro přístup zleva a zprava nad wafer	ANO	Ano
21	Pozicionéry s posunem v osách X, Y a Z v rozsahu	>= 10 mm	12.5 mm ve všech směrech X, Y, Z
22	Přesnost nastavení pozice pozicionérů	<= 2µm	<1 µm
23	Dvě vzduchové koplánární měřicí sondy fungující do 110 GHz s 1 mm F koaxiálním konektorem, konfigurací GSG, pitch 100 µm a wolframovými hroty	ANO	Ano
24	Keramický držák kalibračního substrátu	ANO	Ano
25	Kalibrační substrát pro kalibraci vektorového analyzátoru vyrobený na alumině vhodný pro GSG sondy s pitch 100 µm do 110 GHz	ANO	Ano
26	Software pro vektorovou kalibraci kompatibilní se 4-portovým vektorovým analyzátozem ZVA67 od Rohde & Schwarz	ANO	Ano
27	S dodaným zařízením lze po připojení k vektorovému analyzátoru provádět mikrovlnná vektorová měření do 110 GHz po celé ploše waferu	ANO	Ano
28	Napájení pomocí 230 V AC, 50 Hz	ANO	Ano
29	Servisní pracoviště v Evropské unii	ANO	Ano, Thienndorf / SRN
30	Záruka na hardware	>= 1 rok	záruka 2 roky
31	Instalaci zařízení provede výrobce, nebo jím pověřená firma	ANO	Ano